

تغير التأثير الكهرومغناطيسي مع المجال المغناطيسي المسلط لمركبات كهربائية الاجهاد - مغناطيسية الاجهاد

معمر عبد العزيز كامل

جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الفيزياء

الخلاصة

تم في هذا البحث تحضير المواد الكهرومغناطيسية المتكونة من نوع $(x), \text{Ni}_{0.5}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4 [\text{NZFO}] + (1-x) \text{PLZT}$ والتي تتغير فيها قيمة التركيز (x) كما يلي (0, 0.15, 0.30, 0.45, 1) قد حظرت بطريقة تفاعلات الحالة الصلبة. وقد تبين من نتائج حيود الاشعة السينية ظهور نوعين من الاطوار حيث ظهر طور منفرد عند قيم $(x = 0, 1)$ و طور ثنائي عند قيم $(x = 0.15, 0.35, 0.45)$. تم دراسة التركيب المجهرى للنماذج بتقنية ماسح المجهر الالكترونى. تم كذلك دراسة تغير ثابت العزل الكهربائي (ϵ') كدالة للتردد عند المدى $(5 \text{ MHz} - 100 \text{ Hz})$. تم حساب ثابت معامل الفولتية للمجال المغناطيسي (ME) كدالة للمجال المغناطيسي (H) الثابت المسلط أو قد فسر التأثير الكهرومغناطيسي على اساس محتويات طور المركبات المغناطيسية الاجهاد. لوحظ ايضا ان اعلى معامل تحويل للمجال المغناطيسي بلغ (5.45 mV/cm.Oe) للمركب $(\text{NZFO} + 85\% \text{ PLZT } 15\%)$. الكلمات المفتاحية: - التأثير الكهرومغناطيسي، مركبات الاجهاد الكهربائي، فحص الاشعة السينية، تفاعلات الحالة الصلبة.

Variation of Electromagnetic effect with applied magnetic field for pi- ezomagnetic – piezoelectric composites

Muaamar.a.Kamil

University of Tikrit College of Education for Pure Science Department of Physics

Abstract

In this paper electromagnetic materials those are composed from $((x), \text{Ni}_{0.5}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4 [\text{NZFO}] + (1-x) \text{PLZT})$ type in which the value of (x) is constantly changing as follows (0, 0.15, 0.30, 0.45 and 1) and have been prepared by solid state reaction. It is seen from the X-ray diffraction results that, their are types of phases in which the first single phase appears in value of $(x = 0 \text{ and } 1)$ and the second phase appears in value of $(x = 0.15, 0.30 \text{ and } 0.45)$. While the microscopic structure has been preformed by electronic microscope scanning. The variation of the dielectric constant (ϵ') as function of the frequency at the rang (100 Hz to 5 MHz) has also been studied in this research. The static electromagnetic voltage coefficient (EM) has been calculated as a function of applied direct magnetic field (H) the electromagnetic effect has been explained on the basis of the contents of piezomagnetic, phase we have observed that maximum ME conversion factor is (5.45 mV/cm.Oe) for $(15\% \text{ NZFO} + 85\% \text{ PLZT})$ composite.

Key word:- Electromagnetic effect, piezoelectric composites, XRD,, solid states reaction.

المقدمة

ان المركبات القابلة للتمغنط والتي تحتوي على مواد لها القابلية على الاستجابة للمجالين الكهربائي والمغناطيسي يمكن ان تستخدم في تطبيقات خزن البيانات والمعلومات الاستقطاب والحزم الموجية. مولد الموجات البرمية... الخ [1-2]. وهذا ممكن ان يكون دافعا للبحث المركز حول ايجاد مادة في طور الاستعداد لعملية التمكنط تحت تأثير قوة المجال الكهربائية [3]. ان تحديد مزيج مناسب من مواد ذات طور عازل كهربائي ومواد ذات طور مغناطيسي لتحقيق تأثير المجال الكهرو مغناطيسي صعب جدا بسبب :

1 - fe - rite phase تمتلك معامل اجهاد مغناطيسي (p - ezomagnetic coefficient) عالي و مقاوميتها بسبب ان تكون مقارنة للمواد العازلة للكهربائية (fe - roelectric).

2 - piezoma - netic coefficient للمواد العازله للكهربائية (ferroelectric) يجب ان يكون عالي والمقاومية يجب ان تساوي $[4 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}]$.

3 - ان ميكانيكية الاقتان بين المواد العازله للكهربائية (ferroelectric) و طور الفرايت (fe - rite phase) يجب ان تكون مثالية جدا [5].

ولهذه الاسباب قد اعتمدت التركيب التالي $\text{Ni}(\text{Co}, \text{Mn})\text{Fe}_2\text{O}_4 - \text{BaTiO}_3$, $(\text{CoFe}_2\text{O}_4 - \text{Ba})$

TiO_3 - $(\text{NiFe}_2\text{O}_4 - \text{BaTiO}_3)$, $(\text{NiFe}_2\text{O}_4 - \text{TiO}_3)$, $(\text{Pb}_{0.93}\text{La}_{0.07}(\text{Zr}_{0.60}\text{Ti}_{0.40})\text{O}_3 - \text{Ni}, \text{Co})\text{Fe}_2\text{O}_4 - [0.67 \text{ Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3 - 0.33)]$, $[\text{PbTiO}_3]$ [6].

ولذلك قد اعتمد في هذا البحث على التراكيب الاتية (PLZT) , (NZFO) و $(\text{NZFO} + (1-x) \text{ PLZT})$ حيث قيمة $(x=0.15, 0.30, 0.45)$ في حالة تقنية تفاعلات الحالة الصلبة.

ان مجمل خواص المركبات التي لها القابلية على التأثير بالمجالات الكهرومغناطيسية كخواص العزلية الكهربائية مثلا ممكن ان تكون منتظمة وقابلة للفهم من حيث ميكانيكية التنظيم والتشكيل في المركب. كما ان الخواص المغناطيسية والكهربائية قد درست مع تغير الطور الاحادي والطور الثنائي عند قيم $x = 0, 0.15$ [5] and $1, 0.30, 0.45$.

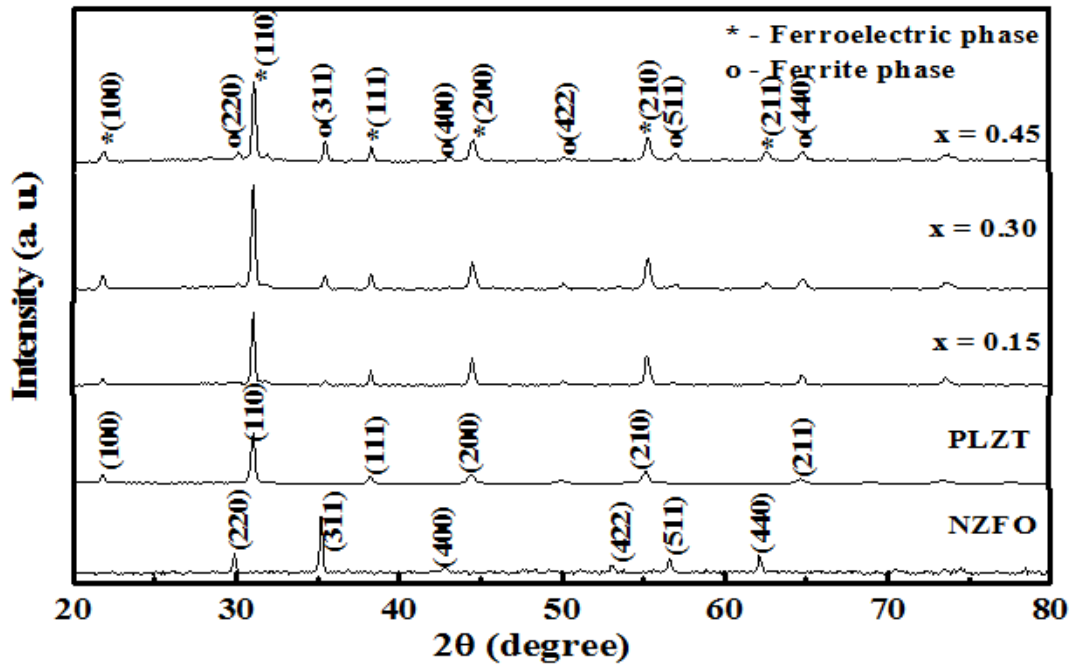
الجزء العملي:

تم تحضير (NZFO) من خلال استخدام طريقة تفاعلات الحالة الصلبة. وقد استخدمت المركبات $(\text{NiO}, \text{ZnO}$ and $\text{Fe}_2\text{O}_3)$ كمكونات اولية للنماذج المحضرت. ان هذه الاوكسيدات خلطة وطحنت لمدة ثلاث ساعات ثم بعد ذلك وضعت عند درجة حرارة (900°C) لمدة (12) ساعة كتسخين اولي ثم لمدة نصف ساعة لتجانس المركبات ثم وضعت عند درجة حرارة (1200°C) . اما تحضير (PLZT) فقد استخدمت المواد الاولية $(\text{PbO}, \text{La}_2\text{O}_3, \text{ZrO}_2, \text{TiO}_2)$ سخنت عند درجة حرارة (1200°C) لمدة (12)

النتائج والمناقشة:

الشكل (1) يبين لنا فحص حيود الاشعة السينية (XRD) التركيب الاولي للمواد الاحادية الطور مثل (PLZT, NZFO) والمركبات التي لا تحتوي على قيمة (0.30, 0.15, 0.45) x . ان المركبات ذات قيم (0.30, 0.15, 0.45) x صنف الى مجاميع (B, A و C) على الترتيب. كل قمم الحيود في فحص الاشعة السينية للمواد (NZFO و PLZT) قد فسرت ورتبت حسب بيانات (JCPDS) لمركب ferrite Ni- ((Zn و PLZT (7/60/40), بطاقة رقم (234-8 و 0504-46) والتي بينت ان الترتيب البلوري للنماذج أ NZFO على تركيب مكعب مزدوج (- a cubic sp nelstructure اما عينات PLZT فهي ذات تركيب بيروفسكايت رباعي (tetragonal, perovskite, structure). لا توجد في قمم حيود الاشعة السينية أي قمم غير مصنفة تشير الى غياب أي طور من الاطوار حتى بعد عمليات التليد للمركبات في درجة حرارة (oC 1150). ان فحص حيود الاشعة السينية بين انه شدة القمم الظاهرة تزداد للمركب (NZFO) بزيادة نسبة تركيز مركب (NZFO) في العينات المنتجة. وهذه النتيجة متفقة مع نتيجة الباحث [7]. ان معامل الشبكة للطور النقي للمركب (NZFO) ($a = 4.0815 \text{ \AA}$, c) ($a = 4.0845 \text{ \AA}$, and $c/a = 1.0007$).

ساعة. ان المواد الاولية المستخدمة صنفت حسب الاوكسيد في كل مادة وكانت. هذه الاوكسيدات طحنت بواسطة مطحنة الكرات السيراميكية ولمدة (3) ساعات وبعدها سخنت لدرجة حرارة (oC 800) لمدة (4) ساعات. واخيرا لدنت هذه المواد في درجة حرارة (oC 1100) لمدة (12). ان طور (NZFO) و طور (PLZT) قد حدد باستخدام تقنية حيود الاشعة السينية (XRD). ان المواد الملدنة بعد خلطها قد تم طحنها لمدة (3-4) ساعات باستخدام مطحنة الكرات السيراميكية وبنسب معينة (15, 30, 45) % و. 45% من طور NZFO و. 55% و. 70% و. 85% من طور PLZT بالترتيب). تم بعد ذلك تم كبس النماذج باستخدام مكبس هيدروليكي خاص بسمك (2 mm) وبقطر (10 mm). واخيرا تم تلدين النماذج بدرجة حرارة (oC 1150) لمدة (10) ساعات وبردت تدريجيا وبيبطن داخل حجرة الفرن. ان التركيب للمواد الاولية المستخدمه وهي في حالة كونها مسحوق تم فحصها باستخدام تقنية حيود الاشعة السينية (XRD) حسب نموذج (model, Bruker D8, Advance). ان معامل الفولتية للمجال الكهرومغناطيسي (dc, (dE/ (ME) (dH)H تم حسابه باستخدام Keithley, Electrom- (eter (Model, 6514) في المجال المغناطيسي الثابت مستخدمين نفس نظام العمل والترتيب. ان النتائج التي حصلنا عليها تقريبا مشابهة للنتائج التي حصل عليها الباحث [6] مع اختلاف طرق التحضير.

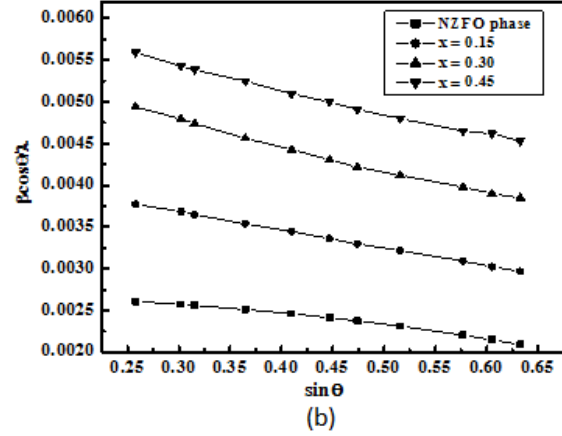
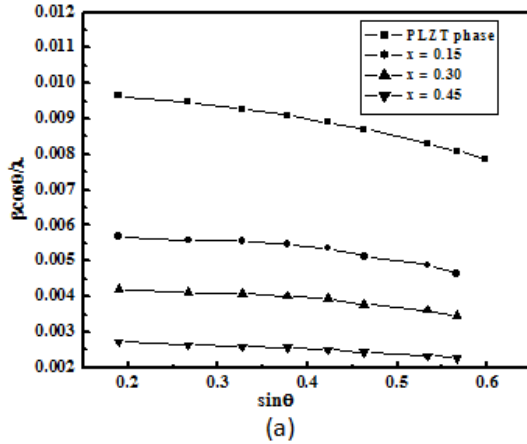


الشكل ١: يمثل حيود الاشعة السينية لطور (NZFO) النقي وطور (PLZT) ومركباتها

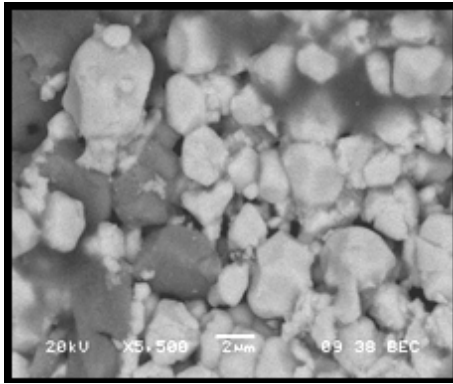
ان اجهاد الشبكة و معدل الحجم البلوري يمكن قياسهما باستخدام معادلة (8) [Hall equation].

$$\frac{\beta \cos \theta}{\lambda} = \frac{1}{\varepsilon} + \frac{\eta \sin \theta}{\lambda} \quad (1)$$

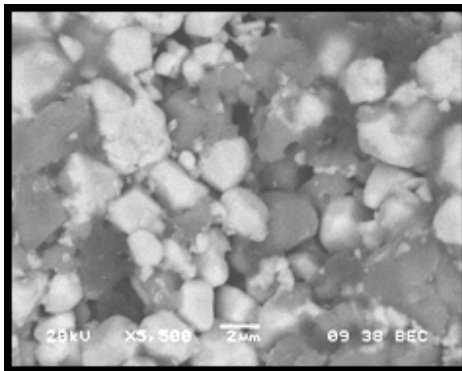
حيث ε = الحجم الحبيبي الفعال (effective crystallite size) η = الاجهاد الفعال (effective strain) β = العرض الكامل في منتصف الحد الاعلى (FWHM) لقمم الحيود (full width at half maximum) λ = الطول الموجي للاشعة السينية (X-ray wavelength) θ = زاوية براك للحيود (Bragg diffraction angle). من خلال النتائج نلاحظ ان منحنى $(\beta \cos \theta / \lambda)$ يتغير مقابل $(\sin \theta)$ تقريبا بشكل خطي وهذا ما نلاحظه في الشكل (a,b).
٢. ان حجم التبلور المؤثر والجهد تم حسابهما من استخدام معادلة الخط المستقيم: $y = \eta x + 1/\varepsilon$ ان معدل الميل لهذه الخطوط يمثل الجهد بينما نقاط التقاطع مع المحور (y) تمثل حجم التبلور الفعال. ان الميل السالب يشير الى وجود اجهاد ضغطي فعال في الشبكة البلورية لاطوار (PLZT و NZFO).



الشكل ٢: يمثل البنية التركيبية تعتمد على جهد الشبكة (a) طور PLZT (b) طور NZFO الموجودة في مركبات EM

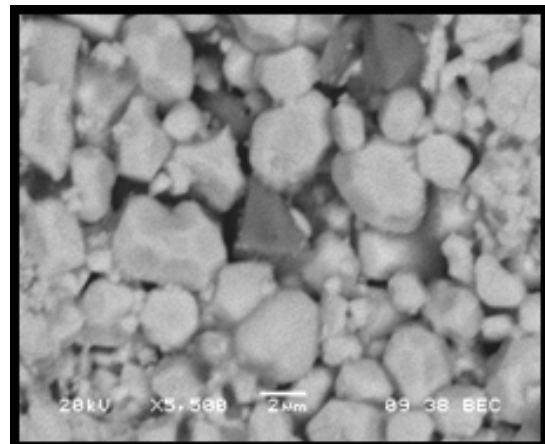


(b)



(c)

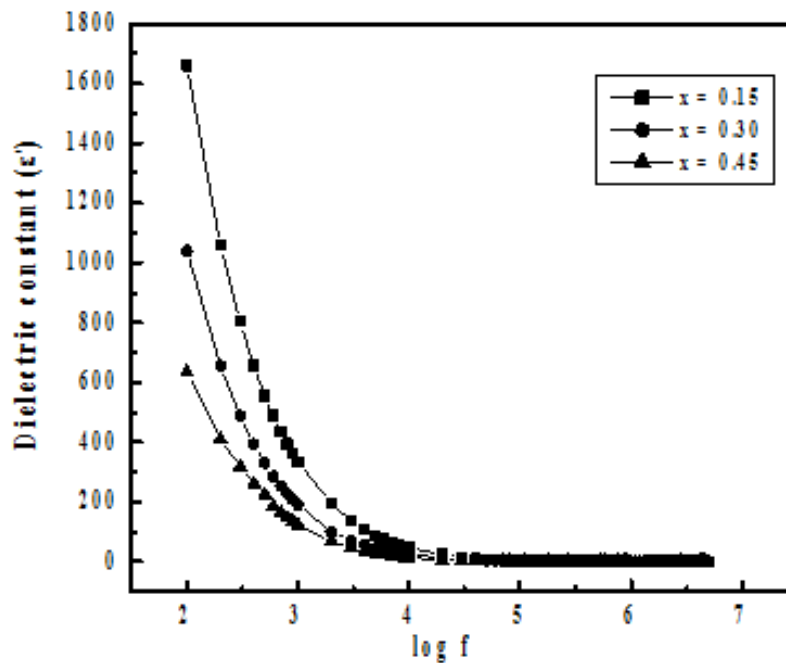
ان فحص جهاز الماسح الالكتروني (SEM) للبنية البلورية للمركبات جميعها موضح في الشكل (3-a-c) اذ تبين الصور مراحل الاختلاف بين الاطوار لمركب (NZFO, و PLZT). اذ تمثل المناطق الفاتحة اللون مركب (PLZT) والمناطق الغامقة اللون مركب (NZFO) كما توضح بان طوري (NZFO, و PLZT) قد مزجا بصورة عشوائية [9].



(a)

الشكل 3. (a,b,c) صور الماسح الالكتروني للمركبات (1-x) PLZT + x NZFO (SEM) (a) x=0.15, (b) x=0.30, (c) x=0.45

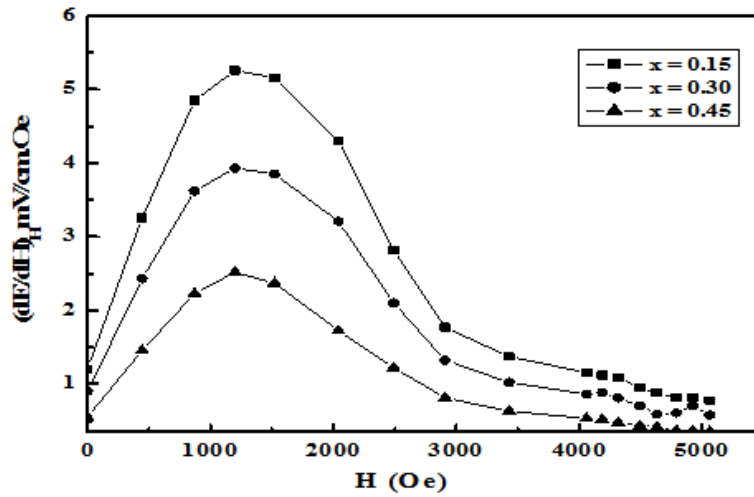
الشكل (4) يوضح التغير في ثابت العزل كدالة للتردد وللمركبات جميعها عند درجة حرارة الغرفة. ان من الملاحظ ان ثابت العزل يقل تدريجيا مع زيادة التردد حيث ان التشتت واضح مع الترددات الواطئة ولهذا السبب نحصل على حد الاشباع في الترددات العالية. ان جميع المركبات اظهرت حالة التشتت بسبب وجود نوع من انواع الاستقطاب الظاهري حسب (Maxwell-Wagner) اذ يتوافق مع نظرية الظواهر المغناطيسية للعالم (10) [Koops]. ان اقصى القيم الظاهرة في الترددات الواطئة ينسب لاختلاف انواع الاستقطاب (الكثروني اذري لينيني ايويني... الخ). ان اعظم قيمة لثابت العزل ظهرت لدينا في الترددات الواطئة وهذا يفسر على اساس تغير مواقع الاستقطاب بسبب عدم تناسق تركيب العازل. ان عدم التناسق ظهر في العينات بسبب (الشوائب الفجوات ترتيب الدقائق) [11]. اما في الترددات العالية يبقى ثابت العزل غير معتمد على التردد بسبب عجز المزدوج الالكتروني عن التوافق مع المجال الكهربائي الناتج من التيار المتناوب [12].



الشكل (4) يوضح التغير في ثابت العزل (ε') مع التردد للمركبات ذات قيمة (x = 0.15، 0.30، و 0.45)

اما الشكل (5) يوضح ان قيم المجال المغناطيسي تعتمد على قيمة معامل ثابت الفولتية (dE/dH) وهي متشابهة في كل المركبات المدروسة في هذا البحث. ان الاستنتاجات التي حصلنا عليها من هذا الشكل تبين معامل الفولتية للمجال المغناطيسي يزداد مع زيادة المجال المغناطيسي. اذ تبين انه حصل لدينا حالة من الاشباع بحدود حوالي (1200 Oe) في النموذج (Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe₂O₄). وفي النماذج جميعها اعلى مجال مغناطيسي حصلنا عليه

ايضا بحدود (1200 Oe) وان المجال الثابت يدل على حدوث طور المغناطيسية. وهذا ينتج عنه مجال كهربائي ثابت في طور المادة القابلة للتمغنط (piezoelectric phase) و بالتالي يجعل قيمة (dE/dH) تقل بزيادة المجال المغناطيسي [13]. من ذلك نستنتج حصول حالة الاشباع المغناطيسي والتي تؤدي الى استجابة تلك المواد للمجالات المغناطيسية الضعيفة [15-16].



الشكل (5) يمثل التغير في ثابت الفولتية للمجال المغناطيسي (EM) مع المجال المغناطيسي المسلط للمركبات ((x) NZFO + (1-x) PLZT

المركبات. ان تغيير نسبة (NZFO) يؤدي الى تغيير ثابت العزل وهذا كان واضحاً. ان اعلى قيمة لثابت المجال الكهرومغناطيسي (ME) بلغ (5.45 mV / cm.Oe) وهذه القيمة ظهرت في المركب (15% (NZFO, + 85% PLZT).

المصادر

- [1] J. P. Rivera, H. Schmid, J. Appl phys, 70(1991) 6410.
 [2] K. Zhao, K. Chen, Y. R. Dai, J. G. Wan and J. S. Zhu, J. Appl. Phys. Lett., 87 (2005)

الاستنتاجات

ان المركبات الحالية حضرت بتقنية تفاعلات الحاله للصلبه وتبين انها تمتلك فقط طور الفيراييت (- fe NZFO rite phase) و طور ferroelectric phase) لا يوجد معها اي شوائب او تداخل في الاطوار. ولحساب الاجهاد فقد استخدمت معادلة (Hall equation) والتي اظهرت الميل السالب لكلا الطورين في مركبات الكهرومغناطيسية (ME) والتي بدورها تؤكد وجود اجهاد الشد. ان ثابت العزل مع التردد اظهر خاصية التشتت للاستقطاب في جميع

- Ye, Y. Lin, J. Appl. Phys., 94(2003) 5930. 162901 .
- [13] J. Van Den Boomgaard, A. M. J. G. Van Run and J. Van Suchtelen, Ferroelectrics, 10 (1976) 295. [3] Broutman and Krock “Modern Composite Materials” (Addison Wesley Publishing Company, California, London), (1967).
- [14] Abdul Samee Fawzi, A. D. Sheikh, V. L. Mathe, Solid State Sci. (2009) In press. [4] D. Arif Sheikh and V. L. Mathe, Smart Mater. Struct, 18 (2009) 065014.
- [15] E. W. Gorter, Philips Res. Rept. 9 (1954) 321. [5] K. K. Patankar, V. L. Mathe, A. N. Patil, S. A. Patil, S. D. Lotke, Y. D. Kolekar and P. B. Joshi, Journal of Electroceramics, 6 (2001) 115.
- [16] Jing-So, K. K. Sickafus and J. M. Wills, J. Am. Ceram. Soc. 82 (1999) 3279. [6] C. M. Kanamadi, L. B. Pujari and B. K. Chougule, J. Magn. Mater. 295 (2005) 139.
- [7] K. K. Patankar, P. D. Dombale, V. L. Mathe, S. A. Patil and R. N. Patil, Mater. Sci. Engg. B 8 (2001) 53.
- [8] H. Gene Haertling, J. Am. Ceram. Soc., 82 (1999) 797.
- [9] B. Vishwanathan and V. R. K. Murty, Ferrite Materials: Science and Technology, Narosa Publishing House, Mumbai (1990).
- [10] C. G. Koops Phys.Rev. 83(1951) 121.
- [11] M. Kiyotake, W. Manfred, J. Appl. Phys. Let., 81((2002) 100.
- [12] C. W. Nan, N. Cai, L. Liu, J. Zhai, Y.